

DIN 50451-7:2018-04 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 7: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salzsäure mittels ICP-MS

| Inhalt | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Einheiten | 5 |
| 5 Kurzbeschreibung des Verfahrens | 5 |
| 5.1 Allgemeines..... | 5 |
| 5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdünnung | 5 |
| 5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen..... | 5 |
| 6 Reagenzien | 5 |
| 7 Geräte und Reinigung | 6 |
| 7.1 Geräte..... | 6 |
| 7.2 Reinigungsverfahren für Gefäße und Pipettenspitzen | 6 |
| 8 Probenahme und Probenvorbereitung..... | 6 |
| 8.1 Probenahme..... | 6 |
| 8.2 Vorbereitung der direkten Messung..... | 6 |
| 8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen..... | 6 |
| 9 Herstellen der Nullwertlösungen und Blindwertprobe..... | 7 |
| 10 Durchführung | 7 |
| 10.1 Messung..... | 7 |
| 10.2 Kalibrierung..... | 7 |
| 11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse..... | 7 |
| 12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse..... | 7 |
| 13 Prüfbericht | 9 |
| Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche..... | 10 |
| Literaturhinweise | 14 |